



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
ФГБОУ ВО «ИГУ»  
**Кафедра общей и экспериментальной физики**



**УТВЕРЖДАЮ**

/ Н.М. Буднев

2022 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

**Наименование дисциплины (модуля):** B1.B.03 Методы исследования материалов и структур электроники

**Направление подготовки:** 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

**Направленность (профиль) подготовки:** Измерение и модификация свойств наноматериалов и наноструктур

**Квалификация выпускника:** Магистр

**Форма обучения:** очная

Согласовано с УМК:  
физического факультета  
Протокол № 33 от «31» марта 2022 г.

**Председатель:** д.ф.-м.н., профессор  
Н.М. Буднев

**Рекомендовано кафедрой:**  
общей и экспериментальной физики

**Протокол №** 6  
от «24» марта 2022 г.

**Зав. кафедрой** д.ф.-м.н., профессор  
А.А. Гаврилюк

Иркутск 2022 г.

**Содержание**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. Цели и задачи дисциплины (модуля) .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>II. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>III. Требования к результатам освоения дисциплины .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>IV. Содержание и структура дисциплины (модуля) .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>    4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов<br/>учебных занятий и отведенного на них количества академических часов.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>        4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>        4.3. Содержание учебного материала .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>            4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>            4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение<br/>студентами в рамках самостоятельной работы (СРС) .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>            4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>            4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>    а) перечень литературы.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>    б) список авторских методических разработок .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>    в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>VIII. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации.....</b>  | <b>14</b> |

## **I. Цели и задачи дисциплины (модуля)**

**Целями освоения дисциплины «Методы исследования материалов и структур электроники» являются:**

- расширение фундаментальных знаний в области физики полупроводников и диэлектриков.
- ознакомление с основными физическими и физико-химическими методами исследования состава полупроводников и диэлектриков
- формирование личности, подготовленной к профессиональной деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки (в том числе к научно-исследовательской работе) в области фундаментальной и прикладной физики полупроводников и диэлектриков.

**Задачами** дисциплины являются следующие:

- 1) Развитие мышления студентов, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- 2) Ознакомление студентов с представлениями о современных методах исследования состава полупроводников и диэлектриков;
- 3) изучение основных принципов работы современных измерительных комплексов для исследования физико-химических свойств полупроводниковых и диэлектрических материалов;
- 4) Развитие навыков делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований.

## **II. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина Б1.В.О3 «Методы исследования материалов и структур электроники» является дисциплиной профессионального цикла и относится к базовой части образовательной программы по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» магистерской программы «Измерение и модификация свойств наноматериалов и наноструктур». Курс предполагает наличие у студентов первичных знаний в области физики, химии, спектроскопии полупроводников и диэлектриков.

Дисциплина связана с курсами «Физика конденсированного состояния», «Физическая химия материалов», «Физика диэлектриков», «Физика полупроводников».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

### III. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Осознанно выбирать пути решения научных задач на основе анализа знаний из области физического материаловедения (ПК-2):

#### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Компетенция | Индикаторы компетенций  | Результаты обучения   |
|-------------|---|---|
| ПК-2        | <p>1.1 Знать основные направления развития современного физического материаловедения.</p> <p>1.2 Уметь осуществить выбор экспериментального исследования и модификации материалов и структур электроники и наноэлектроники методами современного материаловедения.</p> <p>1.3 Владеть навыками решения задач исследования, модификации и контроля материалов и структур электроники и наноэлектроники на основе анализа знаний из области физического материаловедения.</p> | <p><b>знатъ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• основные современные методы измерения параметров материалов, понимать физические процессы, лежащие в основе этих методов, уметь объяснить влияние контролируемых параметров материалов на характеристики приборов и структур на их основе</li> <li>• физические принципы построения и работы оборудования для исследования полупроводников и диэлектриков;</li> <li>• современный научно-технический уровень производства и исследований полупроводниковых и диэлектрических материалов.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обосновывать выбор методов исследования для определения характеристик полупроводниковых и диэлектрических материалов при решении конкретной практической задачи;</li> <li>• применять полученные знания для проведения экспериментальных исследований;</li> <li>• участвовать в научных исследованиях, направленных на изучение структуры, состава и свойств полупроводниковых и диэлектрических материалов</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацией о современных тенденциях в развитии методов исследования материалов и структур электроники, их аппаратурного оформления;</li> <li>• навыками интерпретации результатов исследований, полученных отдельными методами.</li> <li>• методами обработки полученных экспериментальных данных на основе современных информационных технологий.</li> </ul> |

## IV. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 80 часов контактной работы.

Занятия проводятся только в очной форме обучения с применением дистанционного контроля самостоятельной работы студентов через ЭИОС факультета. Электронной и дистанционной форм обучения не предусматривается.

На практическую подготовку отводится 36 аудиторных часов (во время выполнения практических заданий).

Форма промежуточной аттестации: зачет.

### 4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

| № п/н                     | Раздел дисциплины/тема  | Семестр | Всего часов | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся, практическую подготовку и трудоемкость (в часах) |              |              | Формы текущего контроля успеваемости; Форма промежуточной аттестации<br>(по семестрам) |  |
|---------------------------|---|---------|-------------|---|--------------|--------------|--|--|
|                           |   |         |             | Контактная работа преподавателя с обучающимися  |              |              |  |  |
|                           |   |         |             | Лекции  | практические | Консультации |  |  |
| 1                         | <b>Введение в физико-химические методы исследований материалов.</b>   | 1       | 21          | 5   | 4            |              | 12      Опрос  |  |
| 2                         | Электрические измерения и методы диагностирования электрических параметров полупроводников и структур электроники | 1       | 21          | 4   | 5            |              | 12      Опрос  |  |
| 3                         | Спектроскопические методы анализа материалов  |         | 20          | 4   | 4            |              | 12      Опрос  |  |
| 4                         | Оптические методы исследования материалов   | 1       | 22          | 5   | 5            |              | 12      Опрос  |  |
| 5                         | Методы рентгеновского анализа материалов.   | 1       | 20          | 4   | 4            |              | 12      Опрос  |  |
| 6                         | Хроматографические методы анализа.  | 1       | 21          | 5   | 4            |              | 12      Опрос  |  |
| 7                         | Резонансные методы исследования   | 1       | 22          | 5   | 5            |              | 12      Опрос  |  |
| 8                         | Основные задачи диагностики состава полупроводников.  | 1       | 21          | 4   | 5            |              | 12      Опрос  |  |
|                           | зачет   | 1       | 4           |   |              | 4            | Тестирование   |  |
|                           | KCP   | 1       | 8           |   |              |              |  |  |
| <b><u>Итого часов</u></b> |   |         | 180         | 36  | 36           | 100          | 8  |  |

## 4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| Семестр | Название раздела, темы  | Самостоятельная работа обучающихся   |  |                     | Оценочное средство | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |
|---------|---|--|--|---------------------|--------------------|--|
|         |   | Вид самостоятельной работы   | Сроки выполнения                           | Трудоемкость (час.) |                    |  |
| 1       | Введение в физико-химические методы исследований материалов.  | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |
| 1       | Электрические измерения и методы диагностирования электрических параметров полупроводников и структур электроники | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |
| 1       | Спектроскопические методы анализа материалов  | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |
| 1       | Оптические методы исследования материалов   | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |
| 1       | Методы рентгеновского анализа материалов.   | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |

| Семестр  | Название раздела, темы                               | Самостоятельная работа обучающихся   |  |                     | Оценочное средство | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |
|--|--|--|--|---------------------|--------------------|--|
|  |  | Вид самостоятельной работы   | Сроки выполнения                           | Трудоемкость (час.) |                    |  |
| 1  | Хроматографические методы анализа.                   | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |
| 1  | Резонансные методы исследования                      | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |
| 1  | Основные задачи диагностики состава полупроводников. | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | После завершения лекций по данному разделу | 12                  | Опрос              | Вся рекомендуемая литература                           |
| 1  | <b>Подготовка к зачёту</b>                           | Работа с лекционным материалом и учебной литературой   | К концу семестра                           | 4                   | Тест               | Вся рекомендуемая литература                           |
| Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час) |  |  |  | 100                 |                    |  |

## **4.3. Содержание учебного материала**

### **Тема 1. Введение в физико-химические методы исследований материалов.**

Общая характеристика физико-химических методов исследований материалов. Достоинства и недостатки физико-химических методов исследований полупроводников и диэлектриков.

Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа.

### **Тема 2. Электрические измерения и методы диагностирования электрических параметров полупроводников и структур электроники.**

Измерения удельного сопротивления и концентрации носителей заряда. Методы исследования концентрации и подвижности носителей заряда: Эффект Холла, метод вольт-фарадных характеристик барьера Шоттки, определение концентрации носителей заряда методом плазменного резонанса, определение концентрации по эффекту Фарадея. Методы измерения параметров неравновесных носителей заряда: Измерение дрейфовой подвижности; Определение времени жизни носителей заряда. Методы исследования зонной структуры материалов: Циклотронный резонанс; методы измерения ширины запрещенной зоны.

### **Тема 3. Спектроскопические методы анализа материалов**

Основы спектроскопических методов анализа. Классификация спектроскопических методов. Методы атомной спектроскопии. Атомно-эмиссионный анализ. Происхождение спектров испускания. Источники возбуждения и способы регистрации спектров. Качественный и количественный анализ по спектрам испускания. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. Источники излучения, атомизаторы, приемники излучения. Масс-спектрометрия, основные принципы ИСП-МС. Особенности схемы и типы масс-спектрометров. Преимущества и проблемы ИСП-МС.

### **Тема 4. Оптические методы исследования материалов**

Контроль качества поверхности пластин и прозрачных пленок по интенсивности отраженного монохроматического излучения. Элипсометрические методы исследования оптических свойств структур диэлектрик-полупроводник. Методы оптической спектроскопии: Молекулярные спектры; Фурье-спектроскопия; Аналитическое использование электронных спектров поглощения; Оптическая электронная спектроскопия в отраженном диффузно-рассеянном свете. Люминесцентные методы анализа веществ.

### **Тема 5. Методы рентгеновского анализа материалов.**

Общие сведения о рентгеновском излучении. Дифракция рентгеновских лучей. Рентгенофлуоресцентный анализ. Рентгеноструктурный анализ. Рентгенофазовый анализ. Тонкопленочная рентгеновская дифрактометрия. Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ.

### **Тема 6. Хроматографические методы анализа.**

Принципы хроматографического разделения веществ. Классификация хроматографических методов анализа по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения, по аппаратурному оформлению, по способу проведения процесса. Области применения хроматографических методов. Хроматографический пик и его параметры. Газовая хроматография: классификация методов. Принципиальная схема хроматографа. Неподвижные фазы, подвижные фазы, требования к ним. Детекторы, их классификация. Методы жидкостной хроматографии. Особенности хроматографического процесса и аппаратуры.

### **Тема 7. Резонансные методы исследования**

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса: Теоретические основы метода; Эффект Зеемана; условие простого резонанса, g-фактор; электрон-ядерное взаимодействие, сверхтонкая структура спектров ЭПР. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса: Магнитный момент ядра и его взаимосвязь с магнитным полем; условие простого ядерного резонанса; спин-спиновое взаимодействие и мультиплетность сигналов ЯМР.

### **Тема 8. Основные задачи диагностики состава полупроводников.**

Простые и сложные полупроводники, полупроводниковые структуры- проблемы получения и диагностики состава (анализа). Влияние макросостава на свойства сложных полупроводников. Примеси, политропия примесей в полупроводниках; примесно-чувствительные свойства. Основные единицы измерения содержание компонентов. Качественный и количественный анализ: Элементный и молекулярный анализ. Определение примесей и основных компонентов. Определение среднего содержания примесей, послойный и локальный анализ. Определение общего содержания примесей в полупроводнике и диагностика электроактивных примесей.

#### **4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ**

| № п/п | № раздела и темы дисциплины (модуля) | Наименование семинаров, практических и лабораторных работ  | Трудоемкость (часы) | Оценочные средства  | Формируемые компетенции |
|-------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                    | 3  | 4                   | 5                   | 6                       |
| 1.    | <b>Тема 1</b>                        | <b>Введение в физико-химические методы исследований материалов.</b>  | 4                   | Контрольные вопросы | ПК - 2                  |
| 2.    | <b>Тема 2</b>                        | <b>Электрические измерения и методы диагностирования электрических параметров полупроводников и структур электроники</b> | 5                   | Контрольные вопросы | ПК - 2                  |

|    |               |   |   |                     |        |
|----|---------------|---|---|---------------------|--------|
| 3. | <b>Тема 3</b> | <b>Спектроскопические методы анализа материалов</b>         | 4 | Контрольные вопросы | ПК - 2 |
| 4. | <b>Тема 4</b> | <b>Оптические методы исследования материалов</b>            | 5 | Контрольные вопросы | ПК - 2 |
| 5. | <b>Тема 5</b> | <b>Методы рентгеновского анализа материалов.</b>            | 4 | Контрольные вопросы | ПК - 2 |
| 6. | <b>Тема 6</b> | <b>Хроматографические методы анализа.</b>                   | 4 | Контрольные вопросы | ПК - 2 |
| 7  | <b>Тема 7</b> | <b>Резонансные методы исследования</b>                      | 5 | Контрольные вопросы | ПК - 2 |
| 8  | <b>Тема 8</b> | <b>Основные задачи диагностики состава полупроводников.</b> | 5 | Контрольные вопросы | ПК - 2 |

#### **4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)**

| № нед. | Тема     | Вид самостоятельной работы  | Задание  | Рекомендуемая литература     | Количество часов |
|--------|----------|---|--|------------------------------|------------------|
| 1.     | Все темы | Внеаудиторная работа  | Изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, конспектирование ответов на контрольные вопросы | Вся рекомендуемая литература | 70               |
| 2.     | Все темы | Закрепление лекционного материала для работы на практических занятиях | Вопросы для текущего контроля  | Вся рекомендуемая литература | 30               |

#### **4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов**

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа помогает студентам:

**1) овладеть знаниями:**

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.);
- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;
- работа со справочниками и др. справочной литературой;

- ознакомление с нормативными и правовыми документами;
- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;
- использование компьютерной техники и Интернета и др.;

**2) закреплять и систематизировать знания:**

- работа с конспектом лекции;
- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;
- подготовка плана;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- заполнение рабочей тетради;
- аналитическая обработка текста;
- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре (конференции, круглом столе и т.п.);
- подготовка реферата;
- составление библиографии использованных литературных источников;
- тестирование и др.;

**3.формировать умения:**

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;
- выполнение расчетов (графические и расчетные работы);
- подготовка к контрольным работам;
- подготовка к тестированию;
- опытно-экспериментальная работа;
- подготовка к курсовым работам.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Осознанно выбирать пути решения научных задач на основе анализа знаний из области физического материаловедения (ПК-2):
  - Знать основные направления развития современного физического материаловедения.
  - Уметь осуществить выбор экспериментального исследования и модификации материалов и структур электроники и наноэлектроники методами современного материаловедения.
  - Владеть навыками решения задач исследования, модификации и контроля материалов и структур электроники и наноэлектроники на основе анализа знаний из области физического материаловедения.

#### **4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)**

*Курсовые работы не предусматриваются*

## **V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **а) перечень литературы**

#### **Основная литература:**

1. Шалаев, А. А. Основы физического материаловедения [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. / А. А. Шалаев ; рец.: В. В. Акимов, А. А. Гаврилюк ; Иркут. гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013 - . - (Методы экспериментальной физики конденсированного состояния). Ч. 1. - 2013. - 159 с. (10 экз.)
2. Шалаев, Алексей Александрович (канд. физ.-мат. наук, снс) Основы физического материаловедения [Текст]: учеб. пособие : в 2 ч. / А. А. Шалаев ; рец.: В. В. Акимов, А. А. Гаврилюк. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013 . Ч. 2. - 2014. - 175 с. (10 экз.)
3. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Епифанов. - Москва: Лань, 2011. - 288 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - Библиогр.: с. 282-283. - ISBN 978-5-8114-1001-9 ::ББК В37я73
4. Методы выращивания и исследования кристаллических материалов [Текст] : лаб. практикум / Иркут. гос. ун-т, Физ. фак. ; ред. Е. А. Раджабов ; рец. В. В. Акимов. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. - 82 с. (10 экз.)



#### **Дополнительная:**

1. Технологии материалов для микро- и наноэлектроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Скоробогатова, Зубрицкий, Петров, Семёнов - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2009. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ.
2. Егранов А. В. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Егранов. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9624-0884
3. Шендрик, Р. Ю. Введение в физику сцинтилляторов - 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю. Шендрик. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9624-0884-2
4. Щука, Александр Александрович. Наноэлектроника [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подготовки "Прикл. математика и физика" / А. А. Щука. - 2-е изд. - ЭВК. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - (Нанотехнологии). - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 15 доступ. - ISBN 978-5-9963-1055-5
5. Павлинский, Гелий Вениаминович. Рентгеновская флуоресценция [Электронный ресурс] : научное издание / Г. В. Павлинский. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9624-0895-8
6. Павлинский, Гелий Вениаминович. Физика рентгеновского излучения [Электронный ресурс] : сб. задач / Г. В. Павлинский ; Иркутский гос. ун-т, Науч. б-ка. - Электрон.

#### **б) список авторских методических разработок**

1. Шалаев, А. А. Основы физического материаловедения [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. / А. А. Шалаев ; рец.: В. В. Акимов, А. А. Гаврилюк ; Иркут. гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013 - . - (Методы экспериментальной физики конденсированного состояния). Ч. 1. - 2013. - 159 с. (10 экз.)
2. Шалаев, Алексей Александрович (канд. физ.-мат. наук, снс) Основы физического материаловедения [Текст]: учеб. пособие : в 2 ч. / А. А. Шалаев ; рец.: В. В. Акимов, А. А. Гаврилюк. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013 . Ч. 2. - 2014. - 175 с. (10 экз.)
3. Методы выращивания и исследования кристаллических материалов [Текст] : лаб. практикум / Иркут. гос. ун-т, Физ. фак. ; ред. Е. А. Раджабов ; рец. В. В. Акимов. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. - 82 с. (10 экз.)

*в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

- Книгафонд - библиотека онлайн чтения. [www.knigafund.ru](http://www.knigafund.ru)
- ЭЧЗ «БИБЛИОТЕХ» <https://isu.bibliotech.ru/>
- ЭБС «ЛАНЬ» <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС «РУКОНТ» <http://rucont.ru> Архив научных журналов
- JSTOR <http://www.jstor.org>
- Сайт кафедры экспериментальной физики <http://medphysics-irk.ru>

## **VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

### **6.1. Учебно-лабораторное оборудование:**

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в учебной аудитории по расписанию.  
Лабораторное оборудование не предусмотрено.

На факультете имеется компьютеризированная аудитория, предназначенная для самостоятельной работы, с неограниченным доступом в Интернет, стандартные средствами просмотра презентаций и других материалов по курсу.

Имеются списки заданий и методическое руководство в электронном и печатном виде, в том числе в авторском учебном пособии.

### **6.2. Программное обеспечение:**

Стандартные сервисы сети Интернет, стандартные средствами просмотра презентаций и других материалов по курсу

### **6.3. Технические и электронные средства:**

Для проведения практических и лекционных занятий в качестве демонстрационного оборудования используются проектор, экран и меловая доска. Используются современные образовательные технологии: информационные (лекции и презентации в Power Point), проектные (мультимедиа, видео, документальные фильмы). Использование глобальной компьютерной сети позволяет обеспечить доступность Интернет-ресурсов и реализовать самостоятельную работу студентов, в ходе которой они могут вычитывать научные статьи по темам курса. На лекциях могут использоваться мультимедийные средства: проектор (CASIO XJ-A241), переносной экран (Classic Solution, T195x195/1MW-LU/B), ноутбук Lenovo B590. На факультете имеется компьютеризированная аудитория, предназначенная для самостоятельной работы, с неограниченным доступом в Интернет.

Материалы: научные статьи и монографии из рецензируемых журналов, рассматривающие современные походы и исследования в области астрономии.

## **VII. Образовательные технологии**

Задачи изложения и изучения дисциплины реализуются в следующих формах деятельности

ности:

- **лекции**, нацеленные на получение необходимой информации, и ее использование при решении практических задач;
- **практические занятия**, направленные на активизацию познавательной деятельности студентов и приобретения ими навыков решения практических и проблемных задач;
- **консультации** – еженедельно для всех желающих студентов;
- **самостоятельная внеаудиторная работа** направлена на приобретение навыков самостоятельного решения задач по дисциплине;
- **текущий контроль** за деятельностью студентов осуществляется на лекционных и практических занятиях в ходе самостоятельного решения задач, в том числе у доски.

## **VIII. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации**

Фонд оценочных средств представлен в приложении.

### **8.1.1. Оценочные средства для входного контроля**

Проводится опрос на первом занятии.

### **8.1.2. Оценочные средства текущего контроля**

*Типы контроля успешности освоения программы студентом:*

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация (зачет);

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра.

Промежуточная аттестация (зачет) - это оценка совокупности знаний, умений, навыков по дисциплине в целом или по ее разделам.

К видам контроля относятся:

- устные формы контроля;
- письменные формы контроля;
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.

*К традиционным формам контроля относятся:*

- проверка выполнения домашнего задания
- зачет
- тест
- контрольная работа

### **8.1.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

**Текущая аттестация** проводится еженедельно. Критерий формирования оценки – посещаемость аудиторных занятий, активность студентов на занятиях, уровень подготовки к семинарам, выполнение домашних работ.

**Промежуточная аттестация (зачет)** проводится в устной форме по билетам, которые содержат одно задание с теоретическими и практическими элементами.

**При оценке знаний и умений учитывается:**

понимание изученного содержания, самостоятельность суждений, степень систематизации и глубины знаний;

содержание умения и возможность его применения в практической деятельности;

наличие ошибок, их количество, характер и влияние на качество выполненной работы, временной норматив.

В процессе контроля проверяется сформированность следующих профессиональных компетенций:  
Способен анализировать современное состояние методов и технологий модификации свойств наноматериалов иnanoструктур;

Способен проводить научные исследования как самостоятельно, так и в коллективе.

Владеет современными технологиями проведения экспериментальных и теоретических научных исследований с использованием, в том числе, сложного физического оборудования. Умеет пользоваться при проведении научных исследований современными информационными технологиями. Обобщает отечественный и зарубежный опыт проведения научных исследований в своей области исследований.

**Разработчик:**

к.ф-м.н., доцент А.А. Шалаев

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей и экспериментальной физики

«24» марта 2022 г.

Протокол № 6

Зав. кафедрой

д.ф.-м.н., профессор А.А. Гаврилюк

**Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.**